第五章 實驗結果與討論

5-1 微米級 Zn₂GeO₄:xMn²⁺螢光體固態法合成之研究

5-1-1 合成條件與 XRD 圖譜分析

本研究以固態法合成 Zn₂GeO₄:xMn²⁺, 當合成溫度升至 1000 時, 可得到單相且結晶性良好之 Zn₂GeO₄:xMn²⁺ (JCPDS CARD No.11-687)。 若合成溫度提高至 1400 時, Zn₂GeO₄ 會發生融化及揮發現象, 因此控 制合成溫度在 1000~1300 之間, 為合成 Zn₂GeO₄ 單相之最佳合成條 件。圖 27 是經不同溫度合成所得 Zn₂GeO₄:2%Mn²⁺系列樣品之 XRD 圖 譜。觀察到隨著燒結溫度的提高,其結晶性越佳且無其他雜相出現。

將合成產物加入少許矽粉作為標準以校正 20 繞射角,經過 Cell Refiment 軟體精算得晶格常數 a = 14.252(3) Å, b = 14.252(3) Å, c = 9.5417(2) Å 與文獻值(JCPDS CARD No.11-687)a = 14.220 Å, b = 14.220 Å, c = 9.510 Å 十分接近。

當 Mn²⁺活化劑被摻雜至 Zn₂GeO₄ 主體時,由於 Zn²⁺和 Ge⁴⁺半徑差 異不小,而 Zn²⁺和 Mn²⁺半徑非常相近(Zn²⁺=0.74 Å,Mn²⁺=0.80 Å)且 Ge-O 之間存在很強的共價鍵,因此可推測本研究所摻雜的 Mn²⁺活化劑應是進 入 Zn²⁺的格位中。圖 28 為摻雜不同 Mn²⁺濃度的 Zn₂GeO₄:xMn²⁺系列樣 品的 XRD 圖譜,當 Mn²⁺摻雜濃度達到 6 %時,並未觀察到其他明顯雜 相存在。此項結果部分佐證 Mn²⁺活化劑因與 Zn²⁺半徑大小相近,應可 被摻入主體晶格 Zn²⁺格位中。此外,可再經由光致發光(PL)光譜特性協 助判定 Mn²⁺活化劑是否已被摻雜入晶格中,此部分研究留待光譜部分再 進行討論。

5-1-2 微米 Zn2GeO4 發光特性之研究

Zn₂GeO₄ 主體本身具有自身活化的現象,而其自身活化的原因至今 尚不清楚,且 Zn₂GeO₄隨著燒結溫度的改變,其光致發光激發與放射光 譜不盡相同。

圖 29 為 1200 時所合成 Zn₂GeO₄ 主體樣品之光致發光圖譜 圖 29(a) 激發光譜顯示波長在 268 nm 304 nm 及 380 nm 處皆有吸收,而圖 29(b) 放射光譜顯示波長在 459 nm、526 nm 及 730 nm 處有一連串的放射帶, 並放射藍綠光。經由圖 30 之全反射光譜得知其能隙為 4.59 eV (約 268 nm),因此在 268 nm 處的吸收帶為主體價帶(valence band)到傳導帶 (conducting band)的吸收,而在波長 304 nm 及 380 nm 處的吸收可能與 O²⁻缺陷有關⁽⁵⁸⁾,且其在 304 nm 及 380 nm 處吸收位置的能量較能隙還 低,所以極有可能為 O²⁻的缺陷形成能隙間的發光中心,而 O²⁻缺陷形成 的陷阱格位(trap site)受配位環境影響,在能隙中形成能量不一的能階, 而由陷阱格位脫出的電子與電洞再結合,產生自身活化的現象,此外, 因陷阱能階的能量高低不一,所以導致放射峰的寬化。

圖 31 為 1300 所合成 Zn₂GeO₄ 主體樣品之光致發光光譜。圖中(a) 顯示波長在 268 nm 及 380 nm 處有吸收,圖中(b)顯示在 453 nm 有一寬 廣的藍色放射峰,和 1200 所合成的主體放射波長明顯不同,推測可能 是因為燒結溫度的不同,造成 O²⁻缺陷的數目及程度不同,導致不同的 缺陷能階進而影響放射波長。

5-1-3 微米 Zn₂GeO₄:xMn²⁺發光特性之研究

Mn²⁺為電子組態為 d⁵的過渡金屬離子,其放射光譜為一寬廣波峰, 放射波長易受主體晶格組成與結構的影響,而放射範圍可由綠色延伸到 深紅色。

圖 32 為 1300 所合成 Zn₂GeO₄:2%Mn²⁺樣品之光致發光光譜圖 圖 32(a)激發光譜顯示波長在 342 nm 處有一寬廣非高斯型(non-Gaussian type)的吸收峰,推測此可能是兩個吸收峰重疊所致,其一為波長 268 nm 處之主體吸收峰;另一則為波長 340 nm 至 460 nm 處一連串的吸收峰應 源自於 Mn²⁺電荷轉移(charge-transfer transition)或是 d⁵ d⁴s¹ 躍遷所造 成的^(59,60)。依據 Orgel 圖⁽⁶¹⁾,此躍遷應是 Mn²⁺取代 Zn²⁺進入 4 配位的環 境,受到四面體結晶場影響,能階分裂為 ⁴D 及 ⁴G。而圖中(b)放射光譜 顯示波長在 532 nm 處有一寬綠光之放射峰,參考 Tanabe-Sugano 之能階 圖(圖 21),推導出此為典型的 ⁴ T₁ ⁶A₁躍遷所造成的。由於 Mn²⁺在四 配位的格位中(弱結晶場)為一綠光之放射,如:Zn₂SiO₄:Mn²⁺;而在六配 位的格位中(較強結晶場),則為一紅光之放射,如:LaMgB₃O₁₂: Mn²⁺⁽⁶²⁾,本研究可推論 Mn²⁺取代 Zn²⁺進入 4 配位格位中。

Mn²⁺在弱結晶場中,其d⁵電子均勻分散在不同能階而形成高自旋, 因此任何躍遷均被選擇律所禁止。但因 Mn²⁺吸收能量範圍在振動耦合能 量範圍(10000~500000 cm⁻¹),因此推測可能因振動耦合而鬆綁選擇律因 而得以發生躍遷⁽⁶³⁾。圖 33 是以 268 nm 及 342 nm 激發波長所得的放射 光譜,發現以 342 nm 為激發波長可得到較強的放射強度,可能以 268 nm 激發後,其部分能量反而被緩解了。

5-1-4 微米 Zn₂GeO₄:xMn²⁺ 摻雜濃度效應之研究

以不同波長激發 Zn₂GeO₄:xMn²⁺的研究顯示波長 340 nm 為最佳激發波長,故本研究選擇以 340 nm 為激發波長以比較不同濃度 Mn²⁺的摻 雜對其發光強度的影響。

圖 34 為 Zn₂GeO₄:xMn²⁺樣品摻雜不同 Mn²⁺濃度的光致發光放射圖 譜。顯示當 Mn²⁺的摻雜量由 x=0.1%增至 6 %時,其放射峰值(_{max})由波 長 527 nm 處偏移至 534 nm,呈現紅位移現象;而其光致發光激發圖譜(如 圖 35 所示)顯示其吸收峰值(_{max})明顯由 325 nm 處偏移至 349 nm,亦 呈現紅位移現象。且隨著 Mn²⁺活化劑的摻雜量越多,Mn²⁺與 Mn²⁺離子 間的交互作用越強,會導致能階的分裂越大,造成其放射峰的半高寬 (FWHM)呈現寬化的情形,Morrell 等人⁽⁶⁰⁾亦在 Zn₂SiO₄:xMn²⁺中觀察到 相似的現象。

Ronda 等人⁽⁶⁴⁾認為若 Mn^{2+} 取代 Zn^{2+} 後會造成結晶場變弱的話,對 照 Tanabe-Sugano 之能階圖(圖 21), $Mn^{2+}(d^5)$ 的 4 T₁ 6 A₁躍遷預期應是 呈現藍位移偏移的現象, Ronda 則認為以 Mn^{2+} 取代 Zn^{2+} 後並非結晶場 變弱而是 Mn^{2+} 與 Mn^{2+} 離子對間自旋交換作用(spin exchange interaction) 增強,結果導致 Mn^{2+} 能階的下降,因而呈現紅位移偏移。

圖 36 為摻雜不同 Mn²⁺濃度之 Zn₂GeO₄:xMn²⁺系列樣品的 PL 放射強 度與 Mn²⁺摻雜濃度 x (%)之關係圖。分析結果顯示:Mn²⁺摻雜濃度達 1 % 時,其 PL 放射強度達最大值。區域 (0 < x < 1 %)顯示隨著 Mn²⁺摻雜量 的增加而 PL 放射強度急遽增加,其成因為更多的發光中心被激發。區 域 (1% < x < 4%)顯示並沒有因 Mn²⁺摻雜量增加,造成 PL 放射強度增

強,反而呈現一個平滑飽和,因其被激發的發光中心雖增加,但其放射的發光中心反而減少。區域 (x>4%)顯示出所謂濃度淬滅效應的現象。

5-1-5 微米 Zn2GeO4:xMn²⁺輝度與 CIE 色度座標之研究

圖 37 是以 340 nm 為激發波長而光柵 1 nm 之 Zn₂GeO₄:xMn²⁺系列樣 品的輝度值與 Mn²⁺摻雜濃度(x)之關係。分析結果顯示:當 Mn²⁺摻雜量達 1%時,其輝度值最大,為 49.4 Cd/m²,此與 PL 的結果相符。

圖 38 是 Zn₂GeO₄:xMn²⁺系列樣品之 CIE 色度座標圖 而 Zn₂GeO₄:1% Mn²⁺的色度座標值約為(0.3114,0.657),發綠偏黃光,肉眼觀察為亮綠色 ,圖 38 亦顯示隨著 Mn²⁺摻雜濃度的增加,色度呈現略微向黃光偏移的 趨勢,而其飽和度也越低。

1996

5-1-6 微米 Zn2GeO4:xMn²⁺螢光衰減期之研究

圖 39 為以 266 nm 的銣:釔鋁紅榴石(Nd:YAG)雷射激發 Zn_2GeO_4 主 體樣品所得的瞬態放射光譜圖(time-resolved spectrum)。顯示在 350 nm 及 700 nm 處有兩個寬的放射峰,其衰減期非常短(< 50 nsec),推測此可 能為主體缺陷的緩解(relaxation)所導致的放射⁽⁶⁵⁾⁽⁶⁶⁾。

圖 40 為 $Zn_2GeO_4:2\%Mn^{2+}$ 樣品的瞬態放射光譜圖。顯示在 530 nm 處有一源自於 Mn^{2+} 的 ${}^{4}T_1$ ${}^{6}A_1$ 躍遷之更強放射,且其衰減期較長(<20 ms),而圖 41 為 $Zn_2GeO_4:6\%Mn^{2+}$ 樣品的瞬態放射光譜圖,其衰減的速 率明顯較 $Zn_2GeO_4:2\%Mn^{2+}$ 快。再經由圖 42 的 $Zn_2GeO_4:xMn^{2+}$ 系列樣品 在 530 nm 處的動力學圖譜可知所 Mn^{2+} 摻雜的濃度越高,其衰減期越 短,當 Mn^{2+} 摻雜的濃度由 1 %增至 6%時,其 10%的衰減期($\tau_{10\%}$)由 14 ms 減短至 1.7 ms,即所謂的濃度淬熄。此濃度淬熄效應可由圖 43 之 Mn^{2+} 的發光及非發光路徑示意圖之動力學機制來解釋,圖中(1)為放光路徑 (radiative process), k_r :放光路徑的速率常數;(2)為非放光路徑 (non-radiative process), k_n :非放光路徑,而衰減期為 $\tau_t=1/(k_r+k_n)$,其中 發光路徑速率 R_r 為一定值,而對非發光路徑速率 R_n 而言:

 $R_n = k'[Mn^{2+}][*Mn^{2+}]$

= k_n[*Mn²⁺].....擬一級反應

因此其非放光路徑常數為 $k_n = k'[Mn^{2+}],$ 與 Mn^{2+} 摻雜的濃度有很大關係, 由此可知 Mn^{2+} 摻雜的濃度越大,其 k_n 值越大,而衰減期 τ_t 越短,即此自 我淬熄(self quchening)的現象主要是經由 Mn^{2+} 的非發光路徑所造成。

圖 44 為 Zn₂GeO₄:xMn²⁺系列樣品在波長為 350 nm 處監測所得的動 力學的光譜。顯示皆可看見在 350 nm 處之主體的放射,且其放光強度 及衰減期皆十分相近,故根據圖 42 與圖 44 可知衰減期時間的縮短主要 決定於 Mn²⁺摻雜的濃度。

5-1-7 微米級 Zn2GeO4:xMn²⁺之表面微結構分析

圖 45、46、47 分別為於 1000 、1100 與 1300 三溫度下所合成 Zn₂GeO₄:6%Mn²⁺樣品之 SEM 影像圖。分析結果顯示螢光體晶粒粒徑於 1000 合成時約在 1.0~3.0 微米;於 1100 合成時約在 4.0~7.0 微米;而

於 1300 合成時約在 10~14 微米。晶粒形貌隨燒結溫度有明顯變化,於 1000 合成時,晶粒形貌接近球狀且顆粒大小較不均勻;於 1100 合成 時,晶粒形貌開始由球狀變扁平且拉長,顆粒大小較均勻;於 1300 合 成時,晶粒接近扁平且晶粒大小均勻的六方體(圖 48 為放大倍率 2000 倍)。

推測可能燒結溫度由 1000 上升至 1200 時, Zn₂GeO₄ 樣品發生部 分融化(partial melting)的現象,導致晶粒間由於 necking 而發生聚集且呈 扁平的現象,而當燒結溫度增至 1300 時,原子間方有足夠擴散 (diffusion)能量進行重新排列。Zn₂GeO₄為六方晶體, a 和 b 晶軸兩方向 成長速率較快,而 c 晶軸方向成長較慢,因而晶粒形貌呈現高對稱的六 方,規則的結晶之產生可能源自於高溫燒結。

5-2 微米 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1%Mn²⁺螢光體固態法合成之研究 5-2-1 合成條件與 XRD 的研究

1896

由於 Zn₂GeO₄ 與 Zn₂SiO₄ 其結構很相似,皆是屬於六方晶系 (Rhombohedral structure)。若以 Si 取代 Ge 的格位,理論上應可得到 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄的固溶液。

圖 49 為燒結溫度在 1300 時所合成 $Zn_2(Ge_{1-x}Si_x)O_4$:1% Mn^{2*} 系列樣 品之 XRD 圖譜。當 Si⁴⁺的取代量增加時, XRD 圖之 20 數值呈現往高角 度偏移的傾向。依照布拉格繞射定律: $2dsin\theta = n\lambda$ (n=1,2,3....), d-spacing 和 20 繞射峰值呈反比。因此,當用離子半徑較小之 Si⁴⁺取代離子半徑較 大之 Ge⁴⁺的格位時,使得晶格 d-spacing 變小導致繞射峰之 20 值逐漸往 高角度偏移。

5-2-2 晶格常數

Zn₂GeO₄ 屬於菱形晶系(Rhombohedral),其空間群為 R-3,圖 50 與 圖 51 分別為 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1%Mn²⁺系列樣品之晶格常數(a 及 c)與 Si 取代量(x)之關係圖,其顯示當 Si 取代量增加時,晶格體積呈現縮小現 象,此外其晶格常數 a 及 c 亦呈線性遞減。本研究所合成 Zn₂GeO₄ 晶格 常數 a=14.252Å 與文獻值 14.220Å 很接近;Zn₂SiO₄ 晶格常數 a 為 13.946Å 與文獻值 13.938Å 也很接近。因此,本研究中 Si 確實進入 Zn₂GeO₄ 晶 格內取代 Ge 之格位,形成具六方結構之固溶液。

5-2-3 微米 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1%Mn²⁺之發光特性之研究

圖 52 為 1300 燒結條件之 $Zn_2(Ge_{1-x}Si_x)O_4:1\%Mn^{2+}$ 系列樣品之光致 發光激發圖譜。顯示 Si 取代量由 0 遞增至 1.0 時,主晶格體積變小,導 致其能隙變小,造成主體晶格激發能量的吸收和 Mn^{2+} 電荷轉移吸收躍遷 往高能量偏移,其吸收峰值(λ_{max})明顯由 344 nm 處偏移至 270 nm,而呈 現藍位移現象。而其光致發光放射圖譜(如圖 53 所示)顯示 Si⁴⁺取代量由 0 遞增至 1.0 時,源自於 Mn^{2+} 之 4T_1 6A_1 躍遷的放射峰值(λ_{max}),由 535 nm 偏移至 522 nm 而呈現一個藍位移偏移的現象。

圖 52 與圖 53 顯示隨著 Si 取代量的增加, Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1%Mn²⁺ 系列樣品之激發與放射光譜強度呈現明顯遞減現象。推測可能原因為 Si 逐漸取代 Ge 的格位, 晶格便隨之縮小,造成晶格內扭力(Strain)增強, 亦可能造成晶格的非序化(disordered),而使得晶體變得不穩定,如此可 能能量吸收後,會透過非輻射緩解的方式釋放能量,放射光譜之強度亦 隨之減弱⁽⁶⁷⁾。另外,亦可能隨著 Si 取代量的增加,則越接近 Zn₂SiO₄:1% Mn²⁺本身之發光特性。

5-2-4 微米級 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1%Mn²⁺輝度與 CIE 色度之研究

圖 54 是以 310 nm 為激發波長而光柵 1 nm 之 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1% Mn²⁺系列樣品的輝度值與 Si 的取代量(x)之關係圖譜 顯示隨著 Si⁴⁺取代 量的增加,輝度值呈線性遞減,當 Si 的取代量達 x=0.8 時,輝度值為 25.8 Cd/m²。

圖 55 為 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1% Mn²⁺系列樣品之 CIE 色度座標圖。顯示 隨著 Si 取代量越多,色度座標值則由綠偏黃的顏色漸漸偏移至綠偏藍的 色調,當 Si 的取代量達 x=0.8 時, CIE 色度座標值為(0.287,0.568)。

5-2-5 微米 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:4%Mn²⁺螢光衰減期之研究

圖 56 為 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:4%Mn²⁺系列樣品在監測波長 530 nm 時之 Mn²⁺螢光衰減動力學光譜。顯示其衰減期並沒有因 Si 取代量的增加有 明顯變化,而圖 57 為 Zn₂(Ge_{0.8}Si_{0.2})O₄:4%Mn²⁺樣品在 530 nm 處之動力 學的圖譜,此衰減期的曲線主要是由三條曲線(amp1、amp2 及 amp3)的 模型(Model)所求得,其所對應的衰減期分別為 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 。圖 58 的 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:4%Mn²⁺系列樣品之衰減期與 Si 取代量(x)關係圖顯示: τ_1 、 τ_2 、 τ_3 亦不隨 Si 取代量的增加而呈明顯變化,由圖 56 及圖 58 可知 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:xMn²⁺系列樣品之衰減期主要決定於 Mn²⁺所摻雜的濃度,與Si 的取代量無太大關係。

其中 τ_1 為最短,推測其可能為缺陷的非發光路徑所造成的衰減,而 τ_2 可能為* Mn^{2+} 的非放光路徑所造成的衰減,而較長 τ_3 可能為* Mn^{2+} 放光 路徑所造成的衰減。

5-2-6 微米 Zn₂(Ge_{1-x}Si_x)O₄:1%Mn²⁺之表面微結構分析

圖 59 61 分別為 1000 下所合成之 Zn₂(Ge_{0.8}Si_{0.2})O₄:1%Mn²⁺、 Zn₂(Ge_{0.6}Si_{0.4})O₄:1%Mn²⁺、Zn₂(Ge_{0.2}Si_{0.8})O₄:1%Mn²⁺的 SEM 影像圖。分 析結果顯示:螢光體晶粒形貌,並沒有隨著 Si 的取代量增加而發生明顯 變化,但晶粒粒徑大小則隨著 Si 取代量的增加而變小。

1896

5-2-7 微米 $(Zn_{1-x}Cd_x)_2$ GeO4 螢光體固態法合成之研究

本研究擬以 Cd^{2+} 系統化取代 Zn^{2+} ,以形成 $(Zn_{1-x}Cd_x)_2$ GeO₄固溶液, 但由於 Zn_2 GeO₄與 Cd_2 GeO₄兩者晶體結構差異甚大,無法形成完全的固 溶液,故 Cd^{2+} 的取代量受到極大限制。實驗發現:適當的反應溫度大約 1000~1200,而當反應溫度達 1300時,有部分反應物揮發。

圖 62 為 1200 所合成 $(Zn_{1-x}Cd_x)_2GeO_4$:1% Mn^{2+} 系列樣品的 XRD 圖 譜。本研究發現摻雜少量的 Cd²⁺時(x=0.10), 生成物中即出現 Cd₂GeO₄ 的相, 顯示 Cd²⁺並未如預期順利進入 Zn₂GeO₄的晶格中取代 Zn²⁺, 反而 生成 Cd₂GeO₄, 而當燒結溫度為 1000 時, 則 Cd²⁺取代量達 x=0.16 時, 亦有 Cd₂GeO₄的結晶相產生。且當 Cd²⁺的取代量增加時, XRD 圖譜 20

數值呈現往低角度偏移的傾向。

5-3 奈米 ZnGa₂O₄:xMn²⁺螢光體熱溶劑法合成之研究

5-3-1 合成條件與 XRD 圖譜分析之研究

本研究以高壓熱溶劑法合成 ZnGa₂O₄:xMn²⁺奈米螢光體,反應溫度 須高於 180 ,才可以得到結晶性較佳的純相(如圖 63 之 XRD 圖所示), 而受限於高壓反應器的耐壓極限,反應溫度通常須低於 220 。

傳統固態合成法,溫度須高於950 才可獲得 ZnGa₂O₄的純相⁽⁶⁸⁾, 而利用濕化學法旨在降低合成溫度,且為製備奈米螢光體。反應溶劑選 擇乙二胺溶液及甲醇和乙二胺溶液之混合液,此因熱溶劑法為高溫高壓 下進行反應,若選擇以水或甲醇作為溶劑,則會形成一個極易氧化的環 境,造成 Mn²⁺氧化成 Mn⁴⁺,因而不易將 Mn²⁺摻雜至與其半徑相近 Zn²⁺ 的四配位格位中。而乙二胺是雙牙基,除了可當溶劑外,亦扮演鉗合角 色以穩定 Zn²⁺與 Mn²⁺的存在,可順利地將 Mn²⁺摻雜至 Zn²⁺至的格位。 截至目前為止,沒有文獻報導以熱溶劑法合成出奈米級 ZnGa₂O₄:xMn²⁺ 螢光體,故本研究之特點在於使用乙二胺為溶劑,成功地在較低溫合成 出 ZnGa₂O₄:xMn²⁺奈米螢光體。

圖 63 為以乙二胺作為溶劑,在不同溫度下所合成的奈米 ZnGa₂O₄:xMn²⁺系列樣品(JCPDS CARD No.38-1240)XRD 圖譜之比較, 分析結果顯示:反應溫度越低,晶體顆粒越小,繞射峰呈現寬化現象越明 顯,此乃粒徑變小至奈米尺寸之結果。

5-3-2 可能反應機制之探討與表面微結構之分析

根據文獻與實驗結果得知,加入尿素有助於 ZnGa₂O₄ 的生成。根據 Majewski 與 Fritz Aldinger⁽⁶⁹⁾等人研究指出:尿素經加熱一段時間後會分 解產生 NH₃與 CO₂,而 NH₃溶於水形成 NH₄OH_(aq),且與溶於水溶液中 的 Zn²⁺錯合生成 Zn(NH₃)²⁺,而溶於水中的 Ga³⁺於鹼性環境下則有利形 成 Ga(OH)⁻₄,再經由勻相成核機制(homogeneous nucleation mechanism) 成長 ZnGa₂O₄之晶體。

其可能反應機制如下所示:

$$(NH_{2})_{2}CO \xrightarrow{\bigtriangleup} 2 NH_{3} + CO_{2}$$

n NH_{3} + Zn²⁺ \longrightarrow Zn(NH_{3})_n²⁺
Zn(NH_{3})_n²⁺ + 2Ga(OH)_{4} \longrightarrow ZnGa₂O₄ + 4 H₂O + n NH₃

由實驗結果發現,若不加入尿素,發現並無任何產物的產生。因為 若不加入尿素,則只是單純的鹽類混合,且尿素的添加量必須過量以確 保 Ga(OH)4⁻的形成為原則,否則有可能形成 Ga(OH)3 沈澱物。另外,若 以氨水取代 Urea 的角色,則實驗結果發現並無任何產物的生成,可能 是氨水於此高溫高壓環境下,氨水早已分解產生 NH3 氣體,降低 NH3 的溶解度,且溶液的 pH 值可能變小,不若尿素是經高溫加熱一段時間 後,才分解產生 NH3 而溶於水中,故此高溫高壓環境下無法以氨水取代 尿素的功能。

圖 64 為熱溶劑法於 180 下使用不同溶劑所合成 ZnGa₂O₄系列樣品

之 XRD 圖譜。結果顯示:以水為溶劑所得產物之 XRD 繞射峰為尖銳, 結晶性佳,代表產物粒徑較大,此粒徑已超出奈米範圍;而以甲醇、乙 二胺或甲醇和乙二胺混合液為溶劑,其粒徑較小,結晶性較差,其 XRD 繞射峰有明顯寬化的現象。推測可能是尿素於水中溶解度佳有利於尿素 分解產生 NH₃與 CO₂ 而形成 NH₄OH_(aq),相較於尿素溶於甲醇、乙二胺 及甲醇和乙二胺之混合液中形成 NH₄OH_(aq)容易,因而有利於 Zn(NH₃)²⁺ 與 Ga(OH)⁻₄之成核反應,因此有較長的時間長晶,有利於晶體的堆積排 列,因而導致粒徑明顯變大,且以水為溶劑的產率明顯較高。

圖 65 為使用甲醇為溶劑,醋酸鋅、硝酸鎵與尿素反應所合成奈米 ZnGa₂O₄ 產物之 TEM 微結構影像圖。顯示其晶粒形貌為平板狀,板狀 晶粒粒徑大概是 500*600 nm 大小,而厚度非常薄(奈米尺寸),並能觀察 到粒子團聚(agglomeration)現象。若將溶劑換成乙二胺,由圖 66 之 ZnGa₂O₄TEM 圖顯示其晶粒形貌為粒徑細小板狀結構,粒徑大約為 10 nm 左右,團聚的現象非常嚴重,此結果與溶劑為甲醇時所合成 ZnGa₂O₄ 具有較大平板狀晶粒形貌不同;而若將溶劑換成甲醇和乙二胺的混合 液,發現晶其粒形貌及大小與以純乙二胺為溶劑結果相似(如圖 67 之 SEM(a)與 67(b)圖所示)。推測乙二胺除了當溶劑外,亦扮演鉗合的角色 ⁽⁷⁰⁾,即 n 莫耳乙二胺會和 1 莫耳 Zn²⁺鉗合產生 Zn(NH₂CH₂CH₂NH₂)n²⁺ 配位錯合物(如圖 68 所示),導致晶粒形貌發生改變,此後再經由圖 73 與 74 光致發光圖譜的分析,更可證明出乙二胺為鉗合劑。

5-3-3 ZnGa₂O₄與 ZnGa₂O₄:xMn²⁺螢光體製程與發光特性之關

聯與比較

奈米螢光體具有許多獨特的物理特性,如非線性光學行為及不尋常 的發光行為。不同的發光行為,包含能隙值變大,導致發光機制為帶間 遷移主導之螢光體吸收光譜呈現藍位移現象,且多具有較高的發光效率 及極短的衰減期。粒子奈米化後,電子軌域之定域化,造成能階非連續 性,不似塊材帶狀分佈,故光譜會呈現位移現象⁽⁷¹⁾。

圖 69(a)與 69(b)分別為固態法與與熱溶劑法所合成 ZnGa₂O₄ 光致發 光圖譜之比較,結果顯示熱溶劑法所合成 ZnGa₂O₄ 光致激發光譜和固態 法所合成者有很大不同。熱溶劑法合成 ZnGa₂O₄ 相較於固態法合成而 言,激發光譜(a)顯示在 267 nm 處之吸收峰往短波長偏移 9 nm 至 258 nm,但強度極弱,且以 367 nm 處為主要的吸收;而放射光譜(b)顯示放 射峰由 440 nm 藍位移至 428 nm,此可能因結晶性的差異,導致熱溶劑 法所合成 ZnGa₂O₄ 的吸收模式不同所致⁽⁷²⁾。

圖 70(a)與 70(b)分別為固態法與熱溶劑所合成 $ZnGa_2O_4:1\%Mn^{2+}$ 致發光光譜之比較,激發光譜(a)顯示熱溶劑法所合成 $ZnGa_2O_4:1\%Mn^{2+}$ 之 Mn^{2+} 吸收峰,相較於固態法,偏移 22 nm (由 302 nm 偏移至 280 nm), 放射光譜(b)顯示: Mn^{2+} 放射峰(${}^{4}T_{1}$ ${}^{6}A_{1}$)由 502 nm 偏移至 496 nm。

上述分析結果顯示:熱溶劑法所合成樣品光致發光光譜與塊材比較 呈現藍位移現象,此即奈米粒子因量子效應而產生藍位移現象。且熱溶 劑法所合成之樣品發光強度皆較固態法之樣品為弱,此可能是因為熱溶 劑法所合成之粒徑小,表面積增大,表面非輻射緩解機率變大或表面消 光缺陷數目增大,較易損失能量,因而造成降發光效率低⁽⁷²⁾。

5-3-4 奈米 ZnGa₂O₄:xMn²⁺發光特性之研究

ZnGa₂O₄ 為一自身活化發藍光的螢光體,放射光譜呈現波長為 440 ~470 nm 之寬廣放射帶。發光機制一般認為是 Ga-O 之間作用力有關(如 Ga-O 的電荷轉移所造成之躍遷)⁽⁷³⁾或為一種 self-trapped-excitation 電子 電洞再結合之躍遷⁽⁷⁴⁾所造成的。

圖 71(1)及(2)分別為熱溶劑法所合成 ZnGa₂O₄ 與 ZnGa₂O₄:1%Mn²⁺ 之光致發光圖譜 圖 71-(a)-(1)之激發光譜顯示未摻雜 Mn²⁺時,在 258 nm 和 350~400 nm 處之吸收為主體吸收;而圖 71-(b)-(1)之放射光譜顯示在 350~500 nm 處之放射為主體放射。圖 71-(a)-(2)激發光譜顯示有摻雜 Mn²⁺時,除在 258 nm 及 350~400 nm 之主體吸收外,而在 280nm 處之 吸收可能為 Mn²⁺電荷轉移(charge transfer)或 d⁵ d⁴ s 躍遷吸收所造成 (59,60), 且為一 parity allowed 之寬譜帶吸收; 而圖 71-(b)-(2)放射光譜顯 示在 496 nm 處有一緣光放射峰,為 Mn^{2+} 之 ${}^{4}T_{1}$ ${}^{6}A_{1}$ 躍遷所造成的, Mn²⁺在四配位(弱場)格位中發射綠光,即 Mn²⁺取代了離子半徑相近的 Zn²⁺至四配位格位中。另外,若以 258 及 280 nm 為激發波長,由圖 71-(b)-(2)及(2)*之放射光譜顯示放射峰位置並無改變,而是以 280 nm 激 發所得到的 Mn²⁺放射強度較強,且皆在 400 nm 處有主體放射峰,顯示 晶格中自身活化中心(self-activted center)並非作為 Mn²⁺能量傳遞者, 而 是扮演能量競爭者的角色,即主體與 Mn²⁺各自吸收激發能量後,因其具 較低的能量的移轉效率或僅存在少量的自身活化中心激發態光子數,故 傳遞至 Mn²⁺能量效率不高。而 Jia 等人指出⁽⁷⁵⁾此自身活化中心可能為 Zn²⁺缺陷所造成的,而此缺陷藉 Mn²⁺活化劑的摻雜而減少此格位的缺

陷,以致降低主體放光強度,增加 Mn²⁺的放射。

5-3-5 反應條件對奈米 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺發光特性之研究

5-3-5-(1) 反應溫度對奈米 ZnGa2O4:2% Mn2+發光性質之研究

圖 72(a) 與 (b) 分 別 為 反 應 溫 度 180 及 195 所 合 成 之 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺的光致發光光譜。激發光譜(a)顯示當反應溫度為 180

時,主體的吸收強度較 Mn²⁺吸收強度強,而當反應溫度升高至 195 時,Mn²⁺的吸收強度大於主體本身的吸收強度,呈現一消一長的情況。 此即為 Mn²⁺和主體產生相互競爭能量的結果。此現象的發生,可能是當 反應溫度提高時,離子在溶劑中的溶解度及擴散速度會增加,同時會具 有較大的動能,因而產生更多的有效碰撞,造成更多的 Mn²⁺取代 Zn²⁺ 至格位有關。因此,Zn²⁺缺陷所造成的自身活化主體的吸收將減弱,而 Mn²⁺的吸收會增加。而放射光譜(b)顯示反應溫度達 195 時,由於更多 Mn²⁺取代Zn²⁺至格位中及粒徑結晶性的提高,明顯看出其Mn²⁺之⁴T₁ ⁶A₁躍遷所造成的放射強度遠大過反應溫度在 180 時。

5-3-5-(2) 溶劑對奈米 ZnGa2O4: 2%Mn2+發光性質效應之研究

圖 73 為以不同比例的甲醇與乙二胺混合液為溶劑所合成的 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺之光致發光激發光譜之比較。結果顯示:隨著甲醇比例 越高,而乙二胺比例越低,其 Mn²⁺電荷躍遷之吸收呈現往藍位移方向偏 移,此乃晶粒粒徑小到奈米尺寸才會發生的現象,可見乙二胺比例越低 其晶粒粒徑越小,此為一特別有趣的現象,推測可能原因為乙二胺除扮 演溶劑角色外,亦扮演更重要的鉗合角色。

Zn²⁺除了和尿素受熱分解生成的 NH₃ 發生錯合,產生 Zn(NH₃)n²⁺ 外,亦更可能會與更具鹼性的乙二胺鉗合產生 Zn(NH₂CH₂CH₂NH₂)n²⁺以 穩定 Zn²⁺,且因立體空間的因素,Zn(NH₂CH₂CH₂NH₂)n²⁺會降低其與 Ga(OH)⁻₄之反應速率,有助於奈米 ZnGa₂O₄的合成。但因鹼性溶劑乙二 胺的溶解度較不佳,過鹼環境易導致晶粒尺寸變大,所以將溶劑改為甲 醇與乙二胺的混合液,為合成奈米 ZnGa₂O₄:xMn²⁺更佳溶劑。而乙二胺 比例低的甲醇與乙二胺混合液,有助於晶粒粒徑變小,推測可能因為乙 二胺比例越低,則形成Zn(NH₂CH₂CH₂NH₂)n²⁺的濃度越低,即反應物濃 度較低,反應速率會較慢,因而造成晶粒粒徑變小。

圖 74 為以不同比例的甲醇與乙二胺混合液為溶劑所合成的 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺之光致發光放射圖譜。分析結果顯示:隨著甲醇比例越 高而乙二胺比例越低的情況下,其Mn²⁺之⁴T₁ ⁶A₁躍遷所造成的發光 越強,這亦是一個很有趣的現象。令人感到好奇的是為何不是甲醇比例 越高,而乙二胺越低有可能會造成Mn²⁺氧化為Mn⁴⁺,因而降低發光強 度呢?因為前述實驗結果顯示:單純用甲醇作為溶劑時,並無法將Mn²⁺ 順利摻雜至Zn²⁺格位中,然而只要加入少量的乙二胺就可以順利將Mn²⁺ 慘雜至Zn²⁺格位中,且乙二胺比例越低,發光強度越強(由圖 75 甲醇量 與光致發光放射強度之關係圖明顯可知)。此現象乃因乙二胺與Mn²⁺ 發生鉗合,此鉗合效應有助於Mn²⁺不易在此高溫高壓的環境下被氧化, 而乙二胺的比例越高,則使得Zn²⁺可能與較多的乙二胺錯合,造成較大 的立體障礙,反而較不利於Mn²⁺進入Zn²⁺的格位中,因此發光強度不

若以乙二胺比例低的甲醇與乙二胺混合液為強, 明顯看出乙二胺為一個 鉗合的角色。

因此,綜合前述反應機制的探討可得知:若單純以水為溶劑,則所合成的 ZnGa₂O₄ 粒徑甚大,且無法將 Mn²⁺順利摻雜至 Zn²⁺的格位中;若 單純以甲醇為溶劑,其晶體粒徑大小確實較以水為溶劑小,而 Mn²⁺亦無 法 順 利 摻 雜 至 Zn²⁺ 的 格 位 中;若 單 純 以 乙 二 胺 為 溶 劑,此 Zn(NH₂CH₂CH₂NH₂)n²⁺的生成有助於穩定 Zn²⁺的存在,且其立體障礙因 素有利於粒徑的變小,然而乙二胺亦可穩定 Mn²⁺的存在,可將 Mn²⁺順 利摻雜至 Zn²⁺的格位中,但因乙二胺的溶解度較差以及過多的乙二胺和 Zn²⁺錯合會不利合成反應,因此將溶劑改為甲醇與乙二胺的混合液,為 合成奈米 ZnGa₂O₄:xMn²⁺之最佳條件。另一方面,亦可選擇乙二胺比例 低的甲醇與乙二胺的混合液作為溶劑,所形成 ZnGa₂O₄:xMn²⁺晶粒粒徑 更小,其發光強度更佳,所以乙二胺扮演一個重要的鉗合角色。

5-3-5-(3) 尿素添加量與奈米 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺發光性質關係之研究

圖 76 為添加不同計量尿素所合成的 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺之光致發光圖 譜,結果顯示尿素之加入量越多,其激發光譜(a)與放射光譜(b)的強度越 弱。尿素的添加,本有助於穩定 Zn²⁺的存在,稍過量的尿素更有利於 Ga(OH)₄⁻的形成,而過多的尿素則會產生過多的 NH₃配位基,此可能使 得 Zn²⁺與兩個以上 NH₃進行錯合,會造成較大的立體障礙,不利於反應 的進行,故所測的發光強度亦隨之下降,在前述乙二胺與甲醇為溶劑時 亦觀察到相同的現象。 5-3-5-(4) Mn²⁺ 摻雜量與奈米 ZnGa₂O₄:xMn²⁺ 發光性質關係之研究

圖 77 為摻雜不同濃度 Mn²⁺之 ZnGa₂O₄:xMn²⁺光致發光光譜。光譜 分析結果顯示:吸收峰和放射峰的位置並沒有明顯改變,僅強度上發生變 化。當摻雜濃度為 0.5 mole %(x 值)時,主體吸收峰強度高於 Mn²⁺的吸 收峰,此可能由於 Mn²⁺進入 Zn²⁺格位的數目不多。而 Mn²⁺之最佳摻雜 量為 4.0 mole %,而當 Mn²⁺的摻雜濃度繼續增加時,其發光強度並未增 強,反而呈現下降趨勢,產生濃度淬滅的現象。

5-3-5-(5) 反應物濃度對奈米 ZnGa2O4:2%Mn²⁺發光性質之研究

圖 78 為不同反應物濃度所合成 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺之光致發光光譜。 分析結果顯示:其吸收與放射峰並沒有因為反應物濃度的改變,而產生明 顯位移現象。此可能是反應物濃度的改變,並未造成粒徑尺寸變大所 致。但其吸收及放射強度隨著反應物濃度增加而提升,因而發光強度提 升。但本研究也發現當反應物濃度過高時,發光強度卻呈現下降現象, 此可能因高溫壓系統下之溶解度已達極限,使得反應物無法完全溶解而 有關。

5-3-5-(6) 表面修飾奈米 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺發光性質之研究

奈米粒子表面活性大,會造成團聚現象,且奈米粒子具有高比表面積,易造成非輻射緩解的陷坑數目增多,導致發光效率變差。因此可藉 著表面修飾,因表面修飾物凡得瓦排斥力,而將奈米粒子分散,同時可 降低非輻射緩解的陷坑數目,提升發光效率⁽⁷⁶⁾⁽⁷⁷⁾。

(1)經氧化三辛基膦表面修飾之 ZnGa₂O₄之 IR 圖

圖 79 為表面經氧化三辛基膦(TOPO)表面修飾 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺之 IR 圖譜。圖 79(a)顯示未修飾之 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺主要之 IR 吸收在 900 至 4000 cm⁻¹,而圖 79(c)顯示經由 TOPO 包覆修飾後之 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺,兩者比對顯示,顯示在 2924、2847、1465 cm⁻¹等處 多了氧化三辛基膦特徵吸收峰,證實氧化三辛基膦藉由形成化學鍵生 成,成功地包覆 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺,而不是單純的物理吸附現象。

(2)經表面修飾 ZnGa₂O₄:Zn²⁺之光致發光光譜

圖 80 為奈米 ZnGa₂O₄:2%Mn²⁺經氧化三辛基膦表面修飾後所得產物 之光致發光光譜,圖中顯示經由氧化三辛基膦表面修飾後,非輻射緩解 的陷坑數目的降低,其激發光譜與放射光譜強度皆呈現明顯的增加,同 時 Mn²⁺的吸收峰亦呈現藍位移,可能於包覆 TOPO 的過程中發生難以 預期的化學反應。